

評価

4探針型薄膜抵抗率計

エヌピーエス社製 KS-TC-40-SB-VR

仕様

- 測定方式 直流4探針法
- 測定対象 拡散層
- 測定範囲 抵抗率 : $1\text{m}\Omega \cdot \text{cm} \sim 500\text{k}\Omega \cdot \text{cm}$
抵抗 : $1\text{m}\Omega \sim 500\text{k}\Omega$
シート抵抗 : $1\text{m}\Omega / \square \sim 500\text{k}\Omega / \square$

測定制度 $\pm 0.2\%$

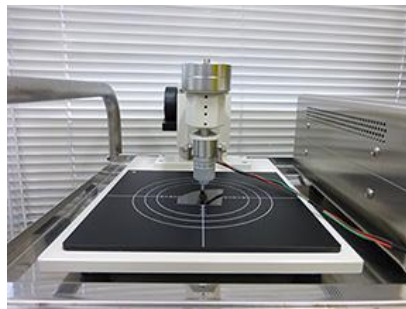
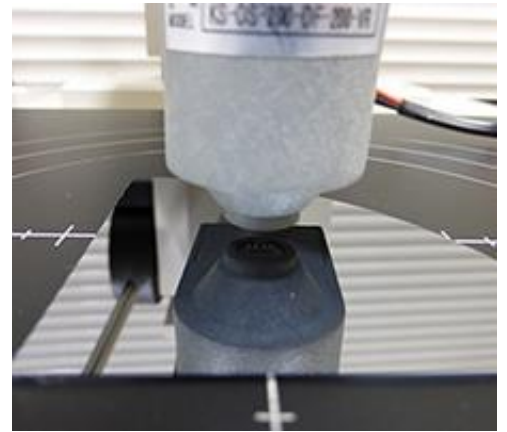
測定時間 約1秒



抵抗率測定

本装置では、直流4探針法により各種電子材料の抵抗率やシート抵抗を精度よく計測することができます。

プローブヘッドを変更することでシリコンウエハや拡散層、金属薄膜などさまざまな試料に対応することができます。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp